

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

REC'D 13 MAY 2004



WIPO PCT

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale No. PCT/FR 03/00045	Date du dépôt international (jour/mois/année) 09.01.2003	Date de priorité (jour/mois/année) 10.01.2002
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB G02B21/26		
Déposant TROPHOS et al.		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.
2. Ce RAPPORT comprend 7 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.
☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).
Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- I ☒ Base de l'opinion
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☐ Certains documents cités
- VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☐ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 01.08.2003	Date d'achèvement du présent rapport 13.05.2004
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Office européen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tél. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Fonctionnaire autorisé Sarneel, A N° de téléphone +31 70 340-3018 

PCT/FR 03/00045

**RAPPORT D'EXAMEN
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n°

PCT/FR 03/00045

5. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration			
Nouveauté	Oui:	Revendications	1-14
	Non:	Revendications	
Activité inventive	Oui:	Revendications	
	Non:	Revendications	1-14
Possibilité d'application industrielle	Oui:	Revendications	1-14
	Non:	Revendications	

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Il est fait référence au document suivant:

D1: US-A-3 652 146

2. Du document D1, un dispositif de positionnement d'une plaque comprenant un ou des échantillons (24) sur un dispositif d'observation ou d'analyse (microscope) et connu, comportant un objectif d'observation ou d'analyse d'au moins une partie d'un échantillon suivant un axe d'observation depuis une face d'observation de la plaque et un châssis (18) muni d'un ensemble de support de la plaque avec les caractéristiques suivantes:

- un premier cadre (20) est déplaçable à coulissement dans un plan perpendiculaire à l'axe d'observation (col. 2, l. 39-45);
- un deuxième cadre (32) supporté par le premier cadre (20) et déplaçable à coulissement dans ledit plan perpendiculaire à l'axe d'observation (col. 2, l. 29-38), les premier et deuxième cadres (20, 32) étant déplaçables selon une direction perpendiculaire à la direction de déplacement de l'autre cadre (voir fig. 2); et
- un troisième cadre (30) supporté par le deuxième cadre (32) par des moyens par des moyens de maintien de ce troisième cadre (30) bloquant ledit troisième cadre dans le plan perpendiculaire à l'axe d'observation, tout en laissant libre le déplacement du troisième cadre essentiellement selon l'axe d'observation.

La seule différence entre le dispositif de positionnement spécifié dans la revendication 1 et celui connu de D1 et donc que ledit troisième cadre est pourvu de moyens de blocage de la plaque. Tels moyens de blocage d'une plaque comportant un échantillon dans un microscope sont très d'usage et par

conséquence, la présente demande ne répond pas au critère figurant à l'article 33(3) PCT, l'objet de la revendication 1 n'impliquant pas d'activité inventive (Règle 65(1)(2) PCT).

3. Les revendications dépendantes 2-14 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la nouveauté et/ou l'activité inventive, et ce pour les raisons suivantes:

Les caractéristiques spécifiées dans ces revendications sont seulement quelques des possibilités que la personne du métier pourrait choisir, selon le cas d'espèce, parmi plusieurs possibilités évidentes, pour résoudre le problème posé sans qu'une activité inventive soit impliquée.
